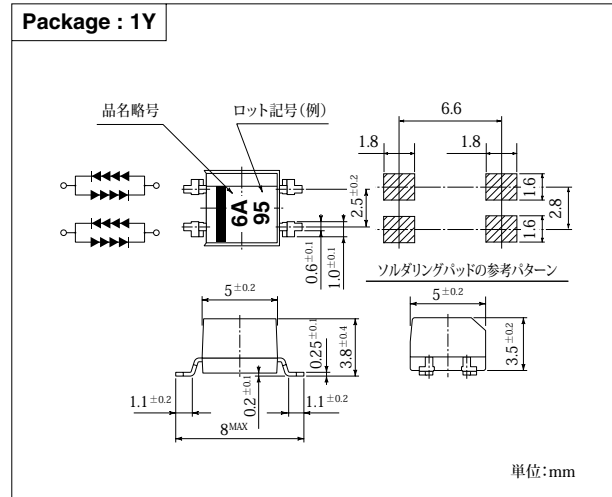


VRYA6

6V

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

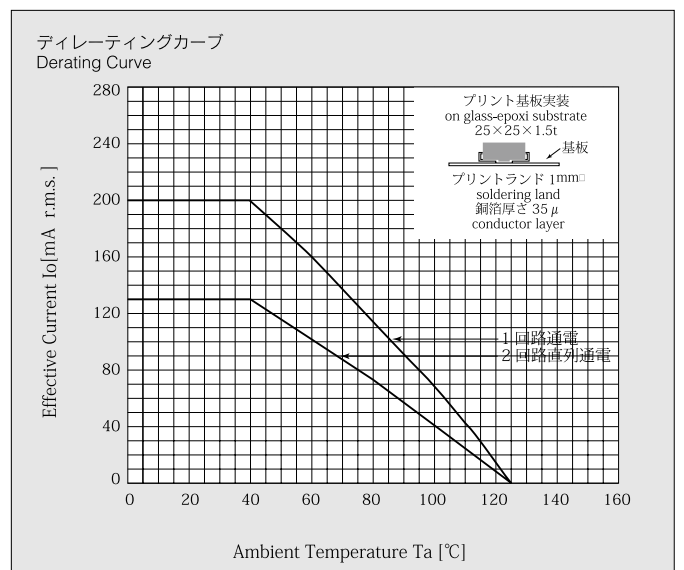
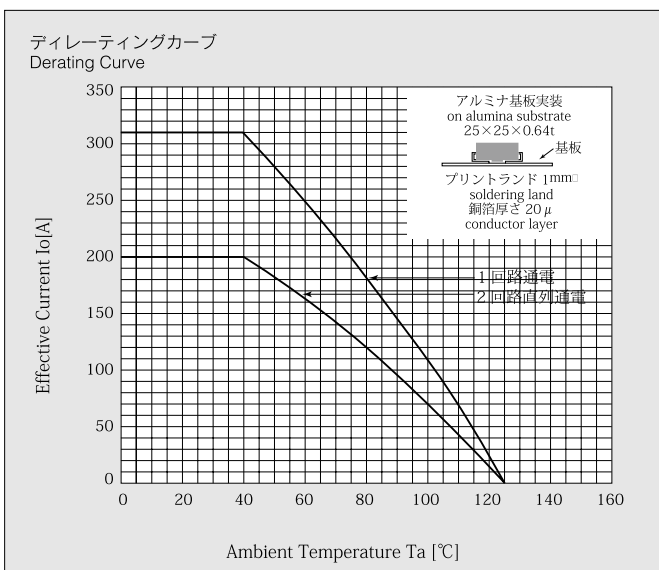
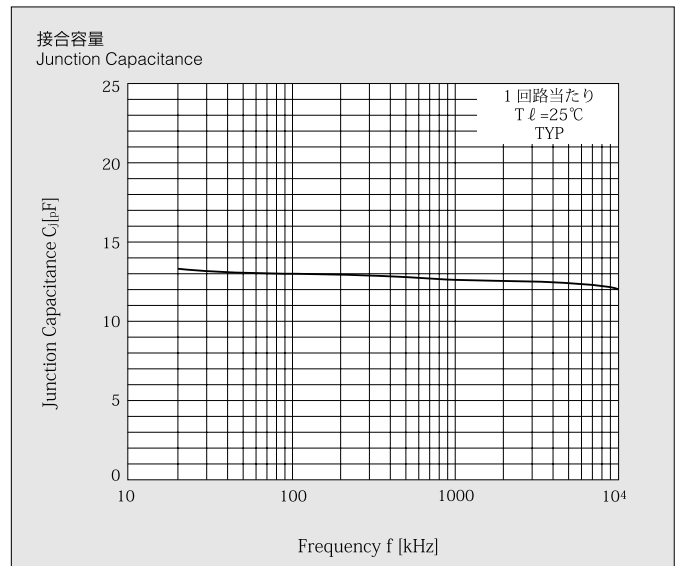
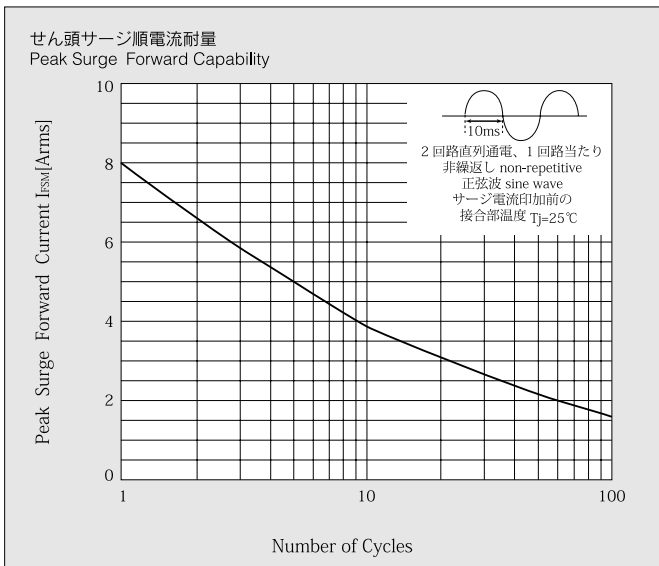
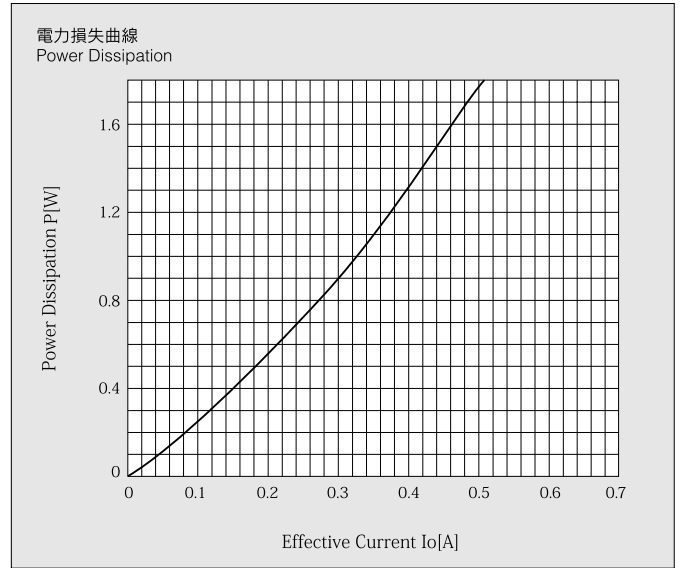
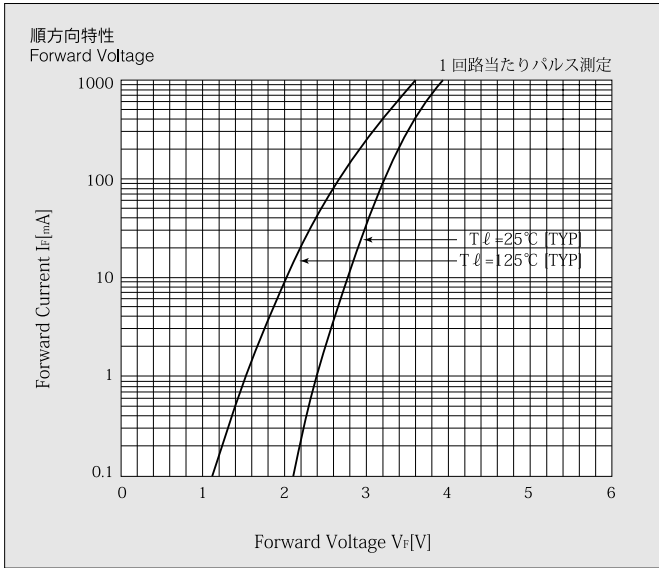
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_1=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions		規格値 Ratings	単位 Unit	
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-30~125	°C	
接合部温度 Junction Temperature	Tj			125	°C	
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	Ta=40°C 正弦波 Sine wave 抵抗負荷 R - load 商用周波数 Commercial frequency	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1 回路通電 1 element operation	310	mA
			プリント基板実装 On glass - epoxy substrate	1 回路通電 1 element operation	200	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波 50Hz Sine wave	非繰り返し Non-repetitive	2 回路通電 2 elements operation	130	A
				2 回路直列通電 2 elements series operation	65	
				2 回路直列通電 2 elements series operation	30	

●電氣的・熱的特性 $T_1=25^\circ\text{C}$ Electrical Characteristics $T_1=25^\circ\text{C}$ (指定のない場合 $T_1=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =1mA	1 回路 1 element	2.05~2.55	V	
			2 回路直列 2 elements series	4.1~5.1		
		I _F =10mA	1 回路 1 element	2.5~3.0		
2 回路直列 2 elements series	5.0~6.0					
I _F =70mA		1 回路 1 element	2.85~3.35			
		2 回路直列 2 elements series	5.7~6.6			
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f=100kHz V _D =0V OSC=50mVrms		TYP 13	pF	
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1 回路通電 1 element operation	MAX 90	°C / W
			プリント基板実装 On glass - epoxy substrate	2 回路通電 2 elements operation	MAX 150	
				1 回路通電 1 element operation	MAX 150	
				2 回路通電 2 elements operation	MAX 250	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typical は統計的な実力を表しています。
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical a statistical average of the devices ability.